

بررسی تأثیر اعمال میدان مغناطیسی در هنگام پرس، بر روی خواص ساختاری، مغناطیسی و مغناطومقاومت ترکیب $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$

مهین اشراقی^۱، پرویز کاملی^۲، هادی سلامتی^۲ و اسماعیل عبدالحسینی سارسری^۲

۱. دانشگاه پیام نور، مرکز نجف آباد

۲. دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۸۶/۳/۱۶؛ دریافت نسخه نهایی: ۸۶/۱۱/۲۴)

چکیده

در این مقاله، دو نمونه همسانگرد(پرس نمونه در غیاب میدان مغناطیسی) و ناهمسانگرد(پرس نمونه در حضور میدان مغناطیسی) از ترکیب $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$ تهیه شده است. برای بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و مغناطومقاومت نمونه‌ها از آنالیزهای XRD، SEM، همچنین اندازه‌گیریهای پذیرفتاری مغناطیسی ac و مغناطومقاومت نمونه‌ها استفاده شد. نتایج آزمایشها نشان می‌دهد که خواص مغناطیسی در نمونه ناهمسانگرد بهبود پیدا کرده و مغناطومقاومت آن کمی تضعیف شده است.

واژه‌های کلیدی: همسانگرد، ناهمسانگرد، مغناطومقاومت، منگنایت، $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$

۱. مقدمه

در این زمینه در کل دنیا شروع شود و پژوهشگران امید دارند در آینده‌ای نزدیک، این دسته از مواد، جایگزین مغناطومقاومتهای بزرگ، GMRها، شوند. از زمان کشف پدیده مغناطومقاومت بسیار بزرگ، CMR، در ترکیب $\text{La}_{1-x}\text{A}_x\text{MnO}_3$ ($\text{A} = \text{Sr}, \text{Ca}, \text{Ba}$)، تحقیقات زیادی بر روی خواص مختلف این دسته از مواد انجام گرفته است [۱-۴]. این دسته از منگنایتها، هم‌مان با یک رفتار عایق‌گونه- فلو به لحاظ الکتریکی، دارای رفتار پارا- فرو از لحاظ مغناطیسی هستند که طبق مدل تبدیل دوگانه قابل توجیه است [۵]. اما پدیده CMR در میدان‌های مغناطیسی حدود چند تسلا و در بازه دمایی محدودی مشاهده می‌شود. اخیراً تأثیر مرزدانه‌ها در منگنایتها پروسکایتی مورد مطالعه قرار گرفته است. هوانگ و همکارانش [۶] نشان دادند، حضور مرزدانه‌ها در نمونه‌های بسیار منجر به یک مغناطومقاومت بزرگ در میدانهای ضعیف، LFMR، و

امروزه به لحاظ تکنولوژی، علاقه زیادی به پدیده مغناطومقاومت، MR، در میان پژوهشگران و صنعتگران وجود دارد. مغناطومقاومت بر حسب درصد به صورت $(\rho_{(0)} - \rho_{(H)}) / \rho_{(0)} \times 100\%$ تعریف می‌شود که در آن $\rho_{(0)}$ و $\rho_{(H)}$ به ترتیب، مقاومت نمونه بدون اعمال میدان و مقاومت نمونه با اعمال میدان است. این اثر، اهمیت زیادی در نحوه کار ابزارهایی از قبیل محیطهای ضبط مغناطیسی، حسگرهای مغناطیسی و آشکارسازهای فروسرخ دارد. اخیراً دسته‌ای از مواد کشف شده‌اند که در آنها مقاومت الکتریکی به عنوان یک خاصیت ذاتی بستگی به نظم مغناطیسی اسپینها دارد و تحت عنوان مغناطومقاومتهای فوق العاده بزرگ، CMR، معروف هستند [۱]. این پدیده باعث شده است که تحقیقات گسترده‌ای

قالب تا فشار ۱۰ تن فشرده شدند (ساخت نمونه ناهمسانگرد در جهت میدان اعمالی).

اگر یک ذره یا پودر مغناطیسی که دارای گشتاور مغناطیسی است، در معرض میدان مغناطیسی قرار بگیرد، از طرف میدان به آن ذره مغناطیسی یک گشتاور مغناطیسی وارد می‌شود. با توجه به اینکه پودرها در محلول آبی گلیسیرین در حضور میدان قرار گرفتند، به آنها آزادی حرکت داده می‌شود که با میدان اعمال شده بچرخدند و در جهت میدان قرار بگیرد. اگر پودرها در حالت خشک تحت تأثیر میدان قرار می‌گرفتند، شرایط لازم برای چرخش فراهم نمی‌شد.

برای ساخت دومین نمونه، پودرهای تکلیس شده به صورت خشک در داخل قالب ریخته شده و به کمک دستگاه پرس، بدون اعمال میدان مغناطیسی و با همان فشار ۳۰ تن پرس شدند (ساخت نمونه همسانگرد).

قرصهای پرس شده در بوتهای مخصوص، از جنس آلومینا قرار داده شدند و در داخل کوره لوله‌ای قابل برنامه‌ریزی به مدت ۲۴ ساعت و در دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند و نهایتاً تا دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد خنک شدند. بدین شکل تأثیر ناهمسانگردی، بین دو قرص ساخته شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی ساختاری نمونه‌های به دست آمده به وسیله دستگاه پراش پرتوی ایکس، XRD، ساخت کارخانه فیلیپس مدل، XPERT، انجام شده است. ریخت شناسی نمونه‌های فوق به وسیله دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ساخت شرکت فیلیپس مدل XL-30 انجام شده است. پذیرفتاری مغناطیسی نمونه‌های به دست آمده به وسیله دستگاه اندازه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی، ساخت شرکت Lake – Shore، مدل ۷۰۰۰ انجام شد و مغناطومقاومت نمونه‌ها نیز به روش ۴ میله و به وسیله دستگاه اندازه‌گیری مقاومت، توسط یخچال مدار بسته، ساخت شرکت Leybold و همچنین الکترومگنت مدل B-E ۱۰، ساخت شرکت Bruck، با حداقل میدان مغناطیسی ۱۵۰۰۰ اورستد اندازه‌گیری شد.

در یک بازه وسیعی از دما زیر دمای کوری می‌شود. تلاش‌های زیادی مبنی بر افزایش LFMР تاکنون صورت گرفته است که از جمله می‌توان تأثیر آلایشی LSMO/CeO_۲ [۷]، LSMO/xTiO_۲ [۸] و اضافه کردن پلیمرهای عایق [۹] را نام برد.

هدف ما در این مقاله، بررسی تأثیر اعمال میدان مغناطیسی، در هنگام پرس، برروی خواص ساختاری، مغناطیسی و مغناطومقاومت نمونه La_{۰.۸}Sr_{۰.۲}MnO_۲ است. در ابتدا شرح مختصری از آزمایشها انجام شده ارائه خواهیم کرد. سپس آزمایشات را مورد تحلیل قرار می‌دهیم و بعد از آن به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت.

۲. آزمایشها

برای ساخت نمونه‌های La_{۰.۸}Sr_{۰.۲}MnO_۲ از روش مرسوم واکنش حالت جامد، در مجاورت هوا استفاده کردیم. مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت نمونه La_{۰.۸}Sr_{۰.۲}MnO_۲ که دارای درجه عبارتند از: La_۲O_۳، MnO_۲ و SrCO_۳ جاذب خلوص بیش از ۹۹٪ هستند. از آنجایی که پودر La_۲O_۳ رطوبت است، جهت کم شدن خطأ در استوکیومتری دقیق ترکیبات فوق، این پودر قبل از توزین، در داخل کوره مکعبی در دمای ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۷ ساعت قرار داده شده است. بعد از بیرون آوردن La_۲O_۳ از کوره، بلافارسله عمل توزین انجام شد. سایش نمونه‌ها به وسیله آسیاب دستی صورت گرفت و نهایتاً یک پودر خاکستری رنگ به دست آمد. پودرهای به دست آمده در کروزه‌های آلومینا ریخته شده و در کوره‌های مکعبی برای مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تکلیس شدند.

پس از اتمام مراحل تکلیس، از مخلوط به دست آمده، دو نمونه، با دو فرایند پرس متفاوت، تهیه شد. برای ساخت اولین نمونه، پودرهای تکلیس شده به صورت محلول آبی (گلیسیرین) در داخل قالب ریخته شدند و با قرار دادن قالب در وسط پیچه حاوی جریان I و به کمک دستگاه پرس، ضمن اعمال میدان مغناطیسی به اندازه ۸۰۰۰ اورستد به موازات محور

۳. تحلیل و بررسی نتایج

برای حصول اطمینان از تشکیل فازهای مورد نظر و همچنین تعیین ساختار بلوری و محاسبه ثابت‌های شبکه در دمای اتاق، از پراش پرتوهای X استفاده می‌شود. در این تحقیق از پراش X با طول موج $\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$ استفاده شد. متأسفانه کارتهای استاندارد این دسته از ترکیبات کمیاب است، بنابراین سعی شده از تازه‌ترین اطلاعات موجود در مقاله‌ها برای تعیین سیستم بلوری و تعیین صفحات در طول پراش استفاده شود. فاصله بین صفحات موجود در طول پراش توسط نرم افزار دستگاه XRD قابل محاسبه است. پس از تعیین سیستم بلوری و دانستن فاصله بین صفحات، ثابت‌های شبکه را براساس روابط مربوط به هر سیستم بلوری محاسبه می‌کنیم. برای تعیین ساختار بلوری و محاسبه ثابت‌های شبکه، طبق اطلاعات گزارش شده و نمودار فازی، منگنایت $\text{La}_{0.8} \text{Sr}_{0.2} \text{MnO}_3$ دارای ساختار بلوری لوزی وجه است [۱۰]. برای تعیین ثابت‌های شبکه این ترکیب، از تبدیل ساختاری لوزی وجه به شش‌گوشی، استفاده می‌کنیم [۱۱].

شکل ۱ الگوی پراش پرتوهای X را برای دو نمونه نمونه‌های $\text{La}_{0.8} \text{Sr}_{0.2} \text{MnO}_3$ (نمونه همسانگرد و ناهمسانگرد) نشان می‌دهد. تحلیل XRD نشان می‌دهد که هر دو نمونه ساختار لوزی وجه دارند.

همان‌طور که می‌دانیم، هر ذره از چندین دانه و هر دانه از چندین حوزه تشکیل شده است. با آنالیز XRD، اندازه دانه‌ها، Crystallites، و با آنالیز SEM، اندازه ذرات، به دست می‌آید. مشاهده می‌شود که شدت قله‌های XRD در نمونه ناهمسانگرد افزایش یافته و تیزتر از نمونه همسانگرد است. طبق معادله شر $D = \frac{\lambda}{B \cos \theta_B}$ [۱۱]، که به صورت $D = \frac{0.9\lambda}{B \cos \theta_B}$ تعریف می‌شود، λ طول موج پرتوی فروپی، B عرض قله در نصف بیشینه، θ_B زاویه برآگ و D اندازه دانه‌ها است. مطابق با این معادله، هر چه قله‌های مربوط به XRD تیزتر باشد، اندازه دانه‌ها بزرگ‌تر است. با استفاده از معادله شر اندازه دانه‌های نمونه همسانگرد (حدود ۲۰ نانومتر) و اندازه دانه‌های نمونه ناهمسانگرد (حدود ۳۷

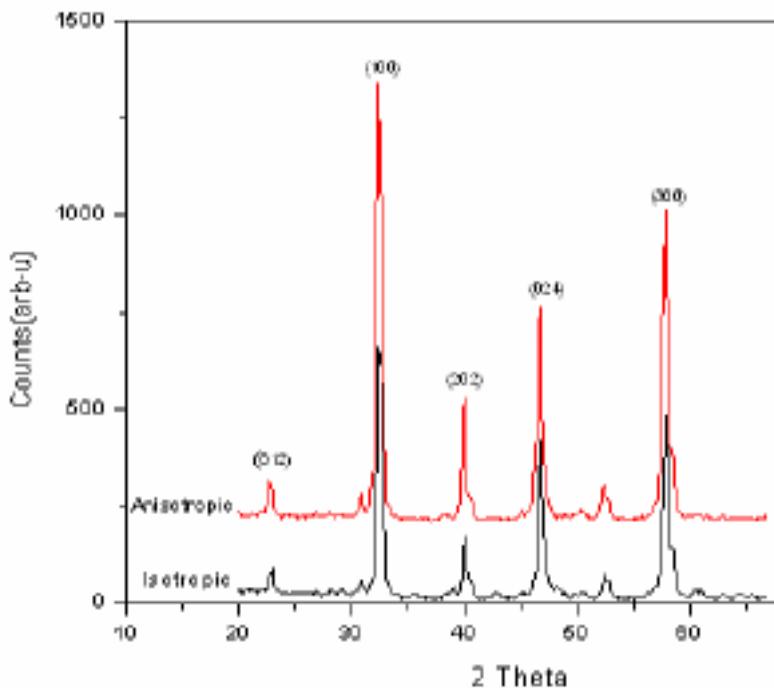
نانومتر) به دست آمده است.

شکل‌های ۲-الف و ۲-ب به ترتیب، تصاویر SEM مربوط به دو نمونه ناهمسانگرد و همسانگرد نمونه $\text{La}_{0.8} \text{Sr}_{0.2} \text{MnO}_3$ هستند. همان‌طور که گفته شد، با آنالیز SEM، اندازه ذرات، به دست می‌آید. ملاحظه می‌شود که مرز بین ذرات در شکل ۲-الف نسبت به شکل ۲-ب با وضوح بیشتری دیده می‌شوند. با توجه به اینکه پرس در محیط آبی انجام شده است، به ذرات فرصت داده می‌شود که برای همراستا نمودن جهت بردار مغناطیش با جهت میدان اعمالی، خود نیز بچرخند. بنابراین طبق شکل ۲-الف، ذرات $\text{La}_{0.8} \text{Sr}_{0.2} \text{MnO}_3$ با نظم بیشتری نسبت به ذرات شکل ۲-ب قرار گرفته‌اند. همچنین چرخش ذرات و قرار گرفتن آنها در کنار هم به هنگام پرس، باعث شده که دانه‌ها سطح تماس بهتری با هم پیدا کنند و در هنگام کلوخه‌سازی بیشتر رشد کنند و بنابراین خلل و فرج کمتری داشته باشند. در واقع به نظر می‌رسد، پرس نمونه در حضور میدان بیشتر باعث رشد دانه‌ها شده است تا رشد ذرات.

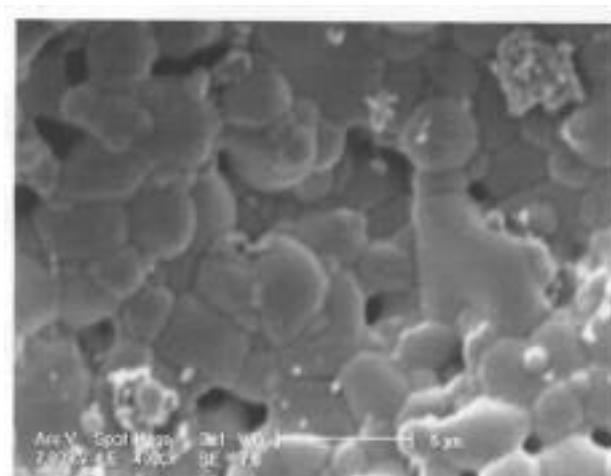
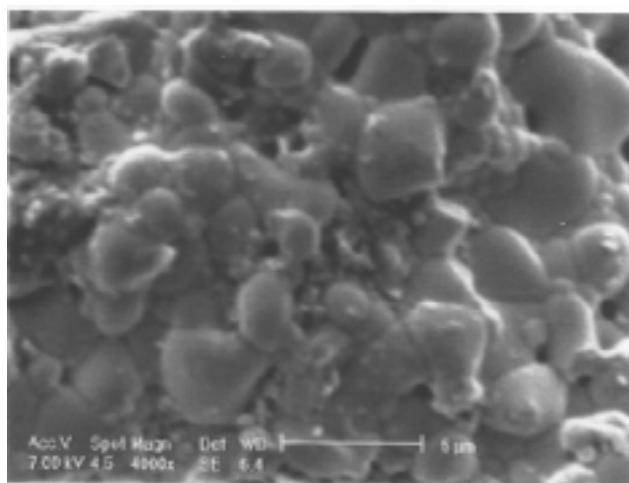
شکل ۳ تغییرات بخش حقیقی پذیرفتاری مغناطیسی ac نمونه‌های $\text{La}_{0.8} \text{Sr}_{0.2} \text{MnO}_3$ را نسبت به دما در میدان ۶/۲۵ اورستد و با بسامد ۳۳۳Hz نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در هر دو نمونه، گذار از حالت پارامغناطیس به فرومغناطیس رخ داده است. همچنین مشاهده می‌شود که مغناطش نمونه ناهمسانگرد بیشتر از نمونه همسانگرد است. دلیل آن را می‌توان به همراستا شدن مغناطش درون دانه‌ها و مرز دانه‌های نمونه ناهمسانگرد مرتبط دانست.

همچنین رشد دانه‌ها در نمونه ناهمسانگرد در مقایسه با نمونه همسانگرد باعث می‌شود که اثرات مرز دانه‌ای در نمونه ناهمسانگرد کمتر خودشان را نشان دهند. مرز دانه‌ها از نظر اسپینی اغلب دارای بی‌نظمی هستند و بنابراین کاهش نسبت سطح به حجم آن در دانه‌های نمونه ناهمسانگرد، باعث بهبود مغناطش می‌شود. این نتیجه قبلًا از تصاویر SEM نیز استنتاج شده بود.

شکل ۴ تغییرات مغناطیس مقاومت نمونه‌های ساخته شده را در



شکل ۱. الگوی XRD از دو نمونه همسانگرد و ناهمسانگرد $\cdot \text{La}_{\text{x}}/\text{Sr}_{\text{y}}/\text{MnO}_\text{z}$

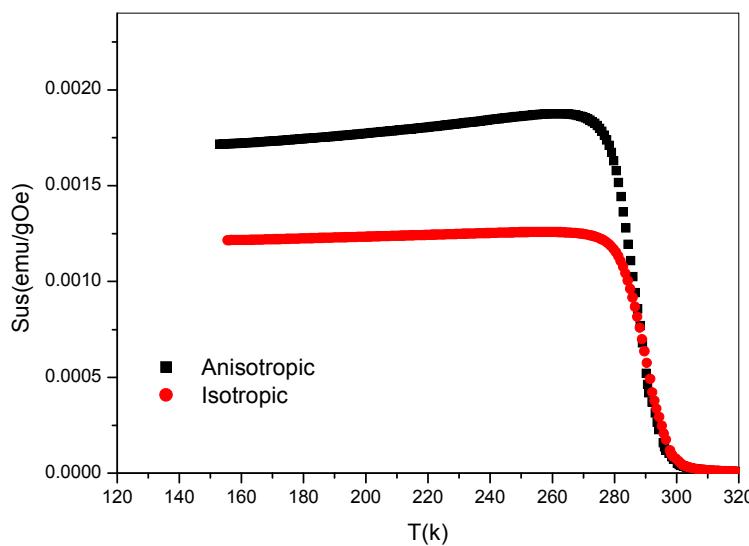


شکل ۲- ب. تصویر SEM از نمونه همسانگرد $\cdot \text{La}_{\text{x}}/\text{Sr}_{\text{y}}/\text{MnO}_\text{z}$

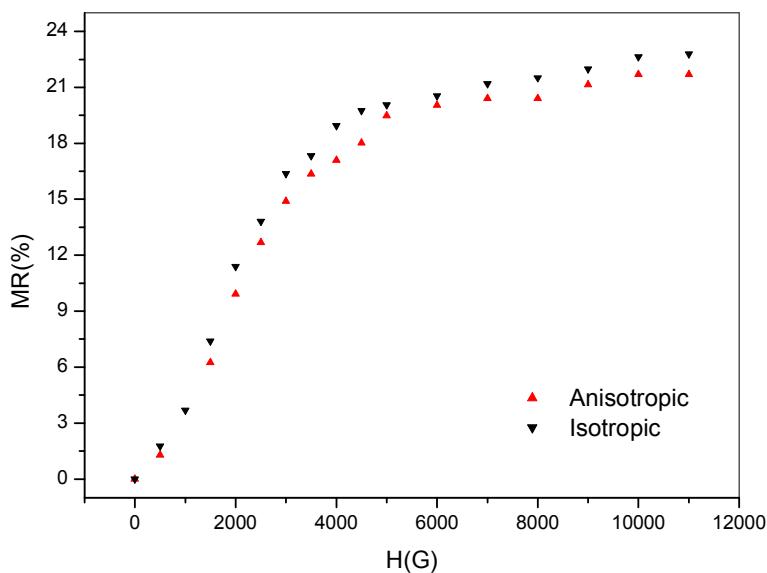
شکل ۲. الف. تصویر SEM از نمونه ناهمسانگرد $\cdot \text{La}_{\text{x}}/\text{Sr}_{\text{y}}/\text{MnO}_\text{z}$.

ناهمسانگرد کمی پایین تر از مغناطومقاومت نمونه همسانگرد شده است. رسانندگی در نمونه های بس بلور منگنایتها به دو طریق انجام می شود [۱۲ و ۱۳]، یکی رسانندگی درون دانه ای و دیگری بین دانه ای. اما هر دو سازو کار رسانندگی، واپستگی زیادی به نظم اسپینی دارد. هر چه نظم بیشتر باشد رسانندگی بیشتر است. به همین دلیل و به خاطر طبیعت نامنظم مرزدانه ها

میدانهای مغناطیسی $\text{H} = 11000 - 11000$ اورستد و در دمای ۵۴ درجه کلوین نمایش می دهد. مغناطومقاومت نمونه ناهمسانگرد، در همان جهت اعمال میدان مغناطیسی اندازه گیری شده است. ملاحظه می شود که در هر دو نمونه، با افزایش میدان مغناطیسی از صفر به ۱۱۰۰۰ اورستد، مقدار مغناطومقاومت، MR، افزایش می یابد. همچنین مشاهده می شود که مغناطومقاومت نمونه



شکل ۳. منحنی تغییرات بخش حقیقی پذیرفتاری مغناطیسی ac بر حسب دما برای نمونه‌های همسانگرد و ناهمسانگرد $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.7}\text{MnO}_3$ در میدان ۵۰۰ آمپر بر متر و در سامد ۳۳۳ هرتز.



شکل ۴. مغناطومقاومت دو نمونه همسانگرد و ناهمسانگرد $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.7}\text{MnO}_3$ در میدانهای ۱۱۰۰۰–۰ اورستد و دمای ۵۴ درجه کلوین.

نسبت به نمونه همسانگرد به این دلیل است که این نمونه دارای نظم اسپینی بیشتری در مرزدانه‌ها است و اعمال میدان مغناطیسی تأثیر کمتری بر این نمونه دارد. به همین خاطر مغناطومقاومت نمونه‌ای که در جهت اعمال میدان مغناطیسی دارای ناهمسانگردی است نسبت به نمونه همسانگرد کمی تضعیف شده است.

نسبت به درون دانه‌ها، مقاومت مرزدانه‌ها بیشتر از درون دانه‌هاست [۱۴] دلیل آن را می‌توان به خاطر پراکندگی وابسته به اسپینها دانست، یعنی هر چه اسپین دارای نظم کمتری باشد پراکندگی بیشتری را سبب می‌شود. بنابراین اعمال میدان مغناطیسی باعث افزایش نظم اسپینی شده و مقاومت را کاهش می‌دهد [۱۴]. در نتیجه مغناطومقاومت با افزایش میدان افزایش می‌یابد. اما کاهش نسبی مغناطومقاومت در نمونه ناهمسانگرد

۴- نتایج

اعمال شده است. نتایج اندازه گیری پذیرفشاری مغناطیسی نشان می دهد که مغناطیس نمونه ناهمسانگرد افزایش پیدا کرده است که علت آن را می توان به افزایش نسبی نظم اسپینی در نمونه ناهمسانگرد نسبت داد. همچنین آزمایشها نشان داد، مغناطیس مقاومت نمونه ناهمسانگرد کمتر از نمونه همسانگرد است. بنابراین ناهمسانگردی ایجاد شده موجب تقویت بافت نمونه و تضعیف مغناطیس مقاومت شده است.

دو نمونه همسانگرد (پرس در غیاب میدان) و ناهمسانگرد (پرس در حضور میدان) $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$ ، با استفاده از روش واکنش حالت جامد تهیه شد. آزمایشها نشان داد که میدان مغناطیسی ۸۰۰۰ اورستد در هنگام پرس، موجب بهبود خواص ساختاری شده، به شکلی که اندازه دانه های نمونه ناهمسانگرد، طبق آنالیز XRD بزرگتر شده است. همچنین آنالیز SEM نشان دهنده چرخش ذرات مغناطیسی در جهت میدان

مراجع

۱۰. م اشرافی، ساخت و مطالعه اثر آلایش مرزدانه ها بر خواص ساختاری، مغناطیسی و مغناطیس مقاومت منگاناتیهای پروسکاتی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، رساله دکتری .(۱۳۸۵)
۱۱. D Cullity, *Elements of X-Ray diffraction* (1978).
۱۲. J Mark Rubinsten, *J. Appl. Phys.* **87** 5019 (2000).
۱۳. Das C M Srivastava, D Bahadur, A K Nigam and S K Malik, *J. Phys. Condens. Matte.* **16** 4089 (2004).
۱۴. N Zhang, W Ding, D Xing and Y Du, *Phys. Rev. B* **56** (1997) 8138.

1. S Jin, T H Tiefel, M Mc Cormack, R A Fastnacht, R Ramesh and L H Chen, *Science* **264** (1994) 413.
2. Y Okimoto, Y Tomioka, Y Onose, Y Otsuka and Y Tokura, *Phys. Rev. B* **57** (1998) R 9377.
3. J B Goodenough, J S Zhou, *Nature*, **386** (1997) 229 .
4. T Terai, T Kakeshita, T Fukuda, T Saburi, N Takamoto, K Kindo and M Honda, *Phys. Rev. B* **58** (1998) 14908.
5. Haghiri- Gosnet and A M Renard, *J-P. Phys. D: Appl. Phys.* **36** (2003) R-127.
6. H-Y Hwang, S-W Cheong, Np ong and B Batlogg, *Phys. Rev. Lett.* **77** (1996) 2041.
7. Ll Balcells, A E Carrillo, B Martinez and J Fontcuberta, *Appl. Phys. Lett.* **74** (1999) 4014.
8. P Kameli, H Salameti, M Eshraghi, M Mohammadizadeh, *J. Appl. Phys.* **98** (2005) 43908.
۹. م اشرافی، ه سلامتی، پ کاملی، کنفرانس ماده چگال زنجان،